Sputter growth and anisotropic magnetoresistance effect in epitaxial thin films of Mn-based Heusler alloys: Mn₂VGa and Mn₂VAl

H. Suto¹, V. Barwal¹, Z. Li¹, K. Masuda¹, T. Sasaki¹, S. Kokado², and Y. Sakuraba¹

¹Research Center for Magnetic and Spintronic Materials, NIMS, Tsukuba, 305-0047, Japan ²Graduate School of Integrated Science and Technology, Shizuoka University, Hamamatsu, 432-8561, Japan

Introduction

Mn-based ferrimagnetic Heusler alloys: Mn₂VGa (MVG) and Mn₂Val (MVA) are expected to possess negative spin polarization, which means that the direction of spin-polarized conduction electrons is opposite to the magnetization direction [1,2]. Such negative spin-polarization materials are of growing technological importance because they can increase the freedom in the structure of spintronics devices and improve their performance [3,4]. In this study, we sputter-deposited epitaxial thin films of Mn₂VGa and Mn₂VAl and investigated anisotropic magnetoresistance (AMR) as AMR can provide insights into the scattering process of spin-polarized conduction electrons [5].

Results

Figure 1 shows the calculated DOS of $L2_1$ ordered MVG and MVA. In both materials, the majority spin band exhibits a gap-like feature near the Fermi energy, which can give rise to negative spin polarization. The spin polarization is higher for MVA as the Fermi energy exists closer to the center of the gap.

Thin films of MVG and MVA were sputter deposited on MgO (001) substrates. The MVG film was deposited at RT and post-annealed at 600°C, and the MVA film was deposited at the substrate temperature of 600°C. The formation of $L2_1$ order was confirmed by the 002 and 111 superlattice peaks in XRD profiles, as shown in Fig. 2.

AMR effect was measured at 10–300 K using the four-probe method. An in-plane magnetic field of 10 kOe was applied to the samples, and a current was introduced along <100> and <110> directions. Figure 3 shows AMR ratio defined as $(R(\varphi) - R_{\perp}) / R_{\perp}$. Both materials exhibited positive and negative AMR for the current along the <110> and <100> directions, respectively, and the AMR ratio slightly enhanced with lowering the temperature. Such a sign change of AMR by the current direction was reported for Co₂MnGa Heusler alloy [6]. In the presentation, we will report the analysis of the AMR results.

Reference

- [1] K. Özdogan, et al., J. Phys.: Condens. Matter 18, 2905 (2006).
- [2] C. Klewe, et al., J. Phys.: Condens. Matter 25, 076001 (2013).
- [3] M. Takagishi, et al., IEEE Trans. Magn. 57, 3300106 (2021).
- [4] H. Suto, et al., Appl. Phys. Express 16, 013003 (2023).
- [5] S. Kokado, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, 024705 (2012).
- [6] T. Sato, et al., Appl. Phys. Express 12, 103005 (2019).
- This work was supported by Advanced Storage Research Consortium (ASRC) and JSPS KAKENHI Grant Number 21K20434, 23K03934.



Fig. 1. Spin-resolved DOS for L21 ordered MVG and MVA.







Fig. 3. AMR curves of MVG and MVA films for the two current directions along <110> and <100>.

スピン角度分解光電子分光実験による Fe4N 薄膜の電子状態の観測

中西楓恋,大和田清貴,黒田健太,角田一樹*,宮本幸治, 奥田太一,佐藤仁,磯上慎二**,増田啓介**,桜庭裕弥**,木村昭夫 (広島大,*原子力機構,**物材機構)

Electronic Structures of Fe4N Thin Films Revealed by Spin-ARPES

K. Nakanishi, K. Ohwada, K. Kuroda, K. Sumida*, K. Miyamoto, T. Okuda,

H. Sato, S. Isogami**, K. Masuda**, Y. Sakuraba**, A. Kimura

(Hiroshima Univ., *JAEA, **NIMS)

<u>背景</u>

逆ペロブスカイト型窒化鉄(Fe₄N)は室温で大きな逆トンネル磁気抵抗 (TMR)効果[1], 負の異方性磁気抵抗 (AMR)効果[2]などの特徴的な輸送特性を示すことから,物性的な興味のみならずスピントロニクス実用材料候補として注目を集めている[3]。輸送特性の起源として,フェルミ準位近傍の状態密度が少数スピンバンドで構成されること,加えて *d* 軌道の少数スピンが電気伝導を支配するという理論的な提案もなされている[4]。これらの理論的な提案を実証し、輸送特性に関する従来の理解を深めるためには,フェルミ準位近傍の電子状態を直接的に観測する必要がある。

<u>実験方法</u>

そこで本研究では、スピン・角度分解光電子分光(Spin-ARPES)実験を用いた。本実験に相応しいバルク単 結晶 Fe₄N 作製が困難なため薄膜形成が必要であるが、それには物質・材料研究機構の超高真空マグネトロン スパッタリング装置を用いた。薄膜試料の清浄表面が必要とされるため、成膜後は可搬型超高真空スーツケ ースで大気暴露なく広島大学放射光科学研究センターHiSOR に輸送した。成膜構成は、MgO(100)基板/Fe₄N(膜 厚 42 nm)である。ARPES と Spin-ARPES 実験をそれぞれ広島大学 HiSOR BL-7 と BL9B にて行った。また第 一原理計算コード WIEN2k を用いて理論的にもバンド構造を求め実験結果と比較した。

<u>実験結果</u>

まず入射光エネルギー(*hv*)を 50 - 120 eV の範囲で変化させて ARPES 実験を行うことにより、面直波数との 関係を見出した。その結果、 Γ 点と M 点を囲む電子ポケットが観測された。次に、*hv*= 85 eV に設定し、 Brillouin zone の Γ -M 高対称線に沿ったバンド構造[Fig.1(a)]といくつかの面内波数 (k_{Λ})におけるスピン分解エ ネルギー分布曲線を測定した。 $k_{\parallel} = 0$ Å⁻¹におけるスピン分解エネルギー分布曲線を Fig.1(b)に示す。その結果、

観測されたフェルミ準位を横切るすべ てのバンドが少数スピン状態に帰属で きることが判明した。これらは、負の AMR 比や逆 TMR 効果の起源として 理論提案された電子状態と矛盾しない 結果と言える[4]。また、第一原理計 算との比較を行ったところ、 Γ 点と M 点を囲む電子ポケットは、それぞ れ FeII サイトの t_{2g} および e_{g} 軌道成分 が優勢であることもわかった。さらに、 講演では Co を Fe サイトに置換した電 子状態の変化についても議論したい。



Fig.1 (a) ARPES energy dispersion curves along the ΓM line acquired at hv = 85 eV. (b) Spin-resolved energy distribution curves acquired at a wavenumber position denoted with red dashed line in panel (a).

参考文献

- [1] Y. Komasaki et al. J. Appl. Phys. 105, 07C928 (2009).
- [2] M. Tsunoda et al., Appl. Phys. Exp. 2, 083001 (2009).
- [3] S. Isogami et al., Adv. Elect. Mater. 9, 2200515 (2023); 磯上慎二, 日本磁気学会会報「まぐね」17, 89 (2022).
- [4] S. Kokado et al., Phys. Rev. B.73,172410 (2006).

Co₂MnSiのバルク敏感スピン分解電子状態

上田茂典, 三浦良雄, 藤田裕一, 桜庭裕弥 物質・材料研究機構 Bulk-sensitive spin-resolved electronic structures of Co₂MnSi S. Ueda, Y. Miura, Y. Fujita, Y. Sakuraba National Institute for Materials Science

フェルミ準位近傍でのスピン偏極度が 100%であるハーフメタルは、伝導に寄与する電子が完全 にスピン偏極しているためスピントロニクス素子への応用が期待されている。ハーフメタル候補物 質の1つである Co₂MnSi を強磁性体電極に用いた磁気抵抗素子において、低温での巨大な磁気抵抗 比は室温では急激に減少することが知られており[1]、この強い温度依存性は、解決すべき課題とし て残されている。磁気抵抗比の温度依存性と Co₂MnSi のバルク領域のスピン偏極度との相関関係の

有無を明らかにするために、我々は近年開発さ れたバルク敏感なスピン分解硬 X 線光電子分光 [2]にて、Co₂MnSi 薄膜のスピン分解電子状態の 温度依存性測定を行った。測定は、SPring-8 BL15XUにて X 線エネルギーを 5.95 keV,総エ ネルギー分解能を 0.65 eV に設定し、低温(21 K) と室温(300 K)にて行った。試料は、MgO(2 nm) 層でキャップされた Co₂MnSi(30 nm)エピタキシ ャル薄膜を用いた。

図 1(a)に、低温で行った Co₂MnSi のスピン分 解硬 X 線光電子スペクトルを示す[3]。多数スピ ンと少数スピン状態に明瞭な差が見られること が分かる。加えて多数スピン状態は金属的なフ ェルミ端を示すのに対し、少数スピン状態はフ ェルミ準位でギャップが開いているのが分かる。 図 1(b)および(c)はそれぞれ低温および室温で測 定したスピン偏極度スペクトルである。両者は 互いによく似ており、温度依存性は殆ど見られ ない。また、ハーフメタル性から予測されるよ うにフェルミ準位で高いスピン偏極度(~90%) を示した。これらの結果は、Co₂MnSi のバルク 領域では少なくとも 300 K まではハーフメタル 性が保持されていることを示している。



図 1: (a) T= 21 K での Co₂MnSi 薄膜のスピン分解 光電子スペクトル.スピン偏極度スペクトル (b) 21 K, (c) 300 K [3].

<u>参考文献</u>

- 1) K. Elphick *et al.*, Sci. Tech. Adv. Mater. **22**, 235 (2021).
- 2) S. Ueda, Y. Sakuraba, Sci. Tech. Adv. Mater. 22, 317 (2021).
- 3) S. Ueda, Y. Miura, Y. Fujita, Y. Sakuraba, Phys. Rev. B 106, 075101 (2022).

スピン輸送測定を用いた歪み Si_{0.1}Ge_{0.9} 伝導帯バレー分裂の推定と 低温における不純物散乱の影響

岡田拓也¹,川嶌一彰¹,山田道洋^{2,3,4},内藤貴大¹,我妻勇哉⁵,澤野憲太郎⁵,浜屋宏平^{2,1,4} (¹阪大基礎エシステム創成,²阪大基礎工 CSRN,³JST さきがけ,⁴阪大 OTRI,⁵東京都市大)

Estimation of valley splitting energy in strained Si_{0.1}Ge_{0.9} by lateral spin transport measurements and effect of impurity scattering at low temperatures

T. Okada¹, K. Kawashima¹, M. Yamada^{2,3,4}, T. Naito¹, Y. Wagatsuma⁵, K. Sawano⁵, and K. Hamaya^{2,1,4} (¹Grad. Sch. Eng. Sci., Osaka Univ., ²CSRN, Osaka Univ., ³JST PRESTO,

⁴OTRI, Osaka Univ., ⁵Tokyo City Univ.)

最近我々は、Ge と同様の伝導帯バンド構造を有する歪み n-Si_{0.1}Ge_{0.9} が、n-Ge を超えるスピン拡散長(λ)およびスピン緩和時間(τ)を示すこ とを明らかにした[1]. これは、歪み印加による伝導帯バレー分裂(ΔE) に起因する移動度の向上およびバレー間スピン反転散乱の減少によ るものと考えられる[2]. 歪み n-Si_{0.1}Ge_{0.9}(111)の ΔE は、理論的に 55-90 meV と予測されているが[2,3]、実験的な検証は行われていない、本研 究では、異なるキャリア濃度(n)を有する歪み n-Si_{0.1}Ge_{0.9}において低温 でのスピン輸送特性を調べ、ΔE の値を実験的に考察した.

キャリア濃度の異なる歪み n-Si0.1Ge0.9 チャネルを用いた横型スピン バルブ素子を作製し、スピン輸送測定を行った. 非局所スピン信号の 電極間距離依存性からそれぞれの濃度に対して λ を見積もり, ホール 効果測定により得られた拡散係数(D)を用いてτを計算した. Fig.1 に, $n \sim 1 \times 10^{18}, 2 \times 10^{18}, 5 \times 10^{18}$ cm⁻³の歪み n-Si_{0.1}Ge_{0.9} と $n \sim 5 \times 10^{18}$ cm⁻³のn-Geにおける τの温度(T)依存性を示す. n~5×10¹⁸ cm⁻³の歪み n-Si_{0.1}Ge_{0.9} (赤)と n-Ge (黒)の結果を比較すると、200 K 以下の低温において歪み *n*-Si_{0.1}Ge_{0.9}のτは顕著に増大している.これは Fig. 2 に示すように, 歪みによる伝導帯バレー分裂によってスピン反転散乱が抑制されて いるためである[1,4]. 200 K 以下で歪みの効果が見られていることか ら, 歪み n-Si_{0.1}Ge_{0.9}の ΔE は, n~5×10¹⁸ cm⁻³ における 200 K でのフェ ルミ準位(E_F)と熱エネルギー(k_BT)の和(~82 meV)より大きいと推定さ れる. さらに $n \sim 5 \times 10^{18}$ cm⁻³の歪み n-Si_{0.1}Ge_{0.9}において, すでにバレ ー間スピン反転散乱が抑制されているにも関わらず、より低濃度の n ~ 1×10¹⁸(青), 2×10¹⁸ cm⁻³ (緑)の歪み n-Si_{0.1}Ge_{0.9} において 50 K 以下で さらに τ が顕著に増大している. これは, 歪み印加によるバレー間ス ピン反転散乱抑制後も,バレー内での不純物誘起スピン反転散乱が存 在することを示唆している.



Fig. 1. *T* dependence of τ for the strained *n*-Si_{0.1}Ge_{0.9} with $n \sim 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ (blue), $n \sim 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ (green), and $n \sim 5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ (red), together with that for *n*-Ge with $n \sim 5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ (black).



Fig. 2. Schematic of the conduction band valleys in the strained *n*-Si_{0.1}Ge_{0.9} with $n \sim 5 \times 10^{18}$ cm⁻³ at 200 K.

本研究の一部は、日本学術振興会科研費(No. 19H05616, No. 19H02175, No. 21H05000), JST さきがけ(No. JPMJPR20BA), スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク(Spin-RNJ), 文部科学省 X-NICS(No. JPJ011438)の支援を受けて行われた.

参考文献

- [1] T. Naito et al., Phys. Rev. Applied 18, 024005 (2022).
- [2] J.-M. Tang et al., Phys. Rev. B 85, 045202 (2012); Y. Song et al., Phys. Rev. Lett. 113, 167201 (2014).
- [3] Q. M. Ma and K. L. Wang, Appl. Phys. Lett. 58, 1184 (1991); R. Vrijen et al., Phys. Rev. A 62, 012306 (2000).
- [4] T. Naito et al., Phys. Rev. Applied 13, 054025 (2020).

単結晶ダイヤモンドを応用した横型スピンバルブ素子における導電性 ナノカーボンオーミック電極の成膜とスピン注入の評価

綿谷 敦志¹,牧 謙汰¹, Sreenath Mylo Valappil¹,堺 研一郎²,大曲 新矢³,吉武 剛¹ (九大¹,久留米高専²,産総研³)

Conductive Nanocarbon Ohmic Electrode and Evaluation of Spin Injection into Spin Valve Devices Utilizing Single Crystal Diamond A.Watatani¹, K.Maki¹, S.M.Valappil¹, K.Sakai², S.Oomagari³, T.Yoshitake¹ (Kyushu Univ.¹, Nit, Kurume College.², AIST³)

研究背景

半導体パワーデバイスにおいて、単結晶ダイヤモンドは高い絶縁耐力と広いバンドギャップを持ち、SiCよ りも優れた材料として注目されている.スピントランジスタは、来のトランジスタに比べて小型化の限界を 克服するため、ソースやドレイン電極に強磁性体材料を使用するデバイスである.材料ではスピン拡散長が 長くなる傾向があり、結晶ダイヤモンドは炭素原子で構成されており、最も原子番号が小さいため、長いス ピン拡散長が期待される.しかし、単結晶ダイヤモンドは広いバンドギャップと負の電子親和力のため、オ ーミック接触の形成が難しいという課題がある.本研究では、超ナノ微結晶ダイヤモンド膜とフォトリソグ ラフィー法を用いて、単結晶ダイヤモンドを中間層として組み込んだ横型スピンバルブ素子を作製、その評 価を行った.

<u>実験方法</u>

まず単結晶ダイヤモンド基板を有機洗浄し,アークプラズマ蒸着法 により導電性ナノカーボンオーミック電極(膜厚:10nm)を成膜し た.その後,フォトリソグラフィー法を用いてレジストパターンを 形成し,対向ターゲット式直流スパッタリング法を用いて強磁性電 極 Fe(膜厚:50nm)を成膜した.さらに,酸素プラズマの影響を抑 えるために Pd 膜(膜厚:5nm)を成膜し,リフトオフを行い,電極 間に 10μmのギャップを形成した.磁気抵抗曲線の測定は,局所ス ピンバルブ効果測定回路を使用し,4端子プローブを用いて室温で行 った.



Fig. 1 electrical circuit for measuring local spin valve signal.

結果と考察

Fig. 2 に異なる B ドープ濃度 (1022 cm-3) を有する単結晶ダイヤモン ド基板を用いたスピンバルブ素子に導電性ナノカーボンオーミック 電極を成膜した試料の磁気抵抗曲線を示す.明瞭なスピンバルブ効 果が観測されなかったが,接触抵抗の低減と磁化反転による抵抗値 の変化が確認された.これは、プロセスの複雑化や Pd 膜、導電性ナ ノカーボンオーミック電極の成膜による Fe 電極の保持力変化が磁化 反転機能に影響を与えたと推測される.

参考文献

- 1) K. Takanashi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 49, 110001 (2010).
- 2) M. Ohishi, et. al., Jpn. J. Appl. Phys. 46, L605 (2007).



Fig. 2 magnetoresistance curves of spinvalve junctions B Concentration:10²²cm⁻³